

Влияние механических напряжений на поверхностную и объемную проводимости некоторых диэлектриков**Bender, Villem; Veimer, Vladimir; Mere, Arvo; Roninson, Aleksander; Silas, Aarne** Электрофизические свойстваполупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 65-72 : ил https://www.ester.ee/record=b1296001*est<https://digikogu.taltech.ee/et/Item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>**Изменение интенсивности рентгенолюминесценции в процессе окрашивания содалитов****Ruus, Tõnu** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 31-37 : илhttps://www.ester.ee/record=b1296001*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>**Изменение параметров интегральных схем при анализе в растровом электронном микроскопе****Meiler, Boriss** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 85-92 : илhttps://www.ester.ee/record=b1296001*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>**Измерение СВЧ фотопроводимости в материалах с высокой проводимостью****Vallaste, Heikki; Mellikov, Enn; Tuvike, Tiit; Palmre, Õie** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрическихматериалов 1986 / с. 57-63 : ил https://www.ester.ee/record=b1296001*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>[e1308121ed89](https://digikogu.taltech.ee/et/Item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89)**Исследование миграции примеси меди в монокристаллах сульфида кадмия****Aarna, Heiti; Reiter, Erik** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 43-48 : илhttps://www.ester.ee/record=b1296001*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>**Перераспределение вещества в поле внешних сил****Aarna, Heiti; Mankin, Romi; Reiter, Erik** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов1986 / с. 39-41 https://www.ester.ee/record=b1296001*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>**Применение в ТПИ растворного электронного микроскопа в материаловедении****Paat, Aadu** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 79-84https://www.ester.ee/record=b1296001*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>**Природа красной полосы люминесценции в CdS : Ag : Cl****Krustok, Jüri; Mädaßon, Jaan; Altosaar, Mare** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрическихматериалов 1986 / с. 23-30 : ил https://www.ester.ee/record=b1296001*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>[e1308121ed89](https://digikogu.taltech.ee/et/Item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89)**Установка для многократного анодного окисления полупроводников****Gavrilov, Aleksei** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 73-78 : илhttps://www.ester.ee/record=b1296001*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>**Физико-химический анализ несовершенных полупроводниковых кристаллов****Kukk, Peeter-Enn** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 3-22 : илhttps://www.ester.ee/record=b1296001*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>**Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов**1986 https://www.ester.ee/record=b1296001*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>**Электрофизические свойства тонкопленочных барьеров шоттки на основе сульфида кадмия, изготовленного методом химической пульверизации****Krunk, Malle; Mellikov, Enn; Seilenthal, Mats** Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрическихматериалов 1986 / с. 49-55 : ил https://www.ester.ee/record=b1296001*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89>[e1308121ed89](https://digikogu.taltech.ee/et/Item/65e24755-71eb-4a99-b9fe-e1308121ed89)